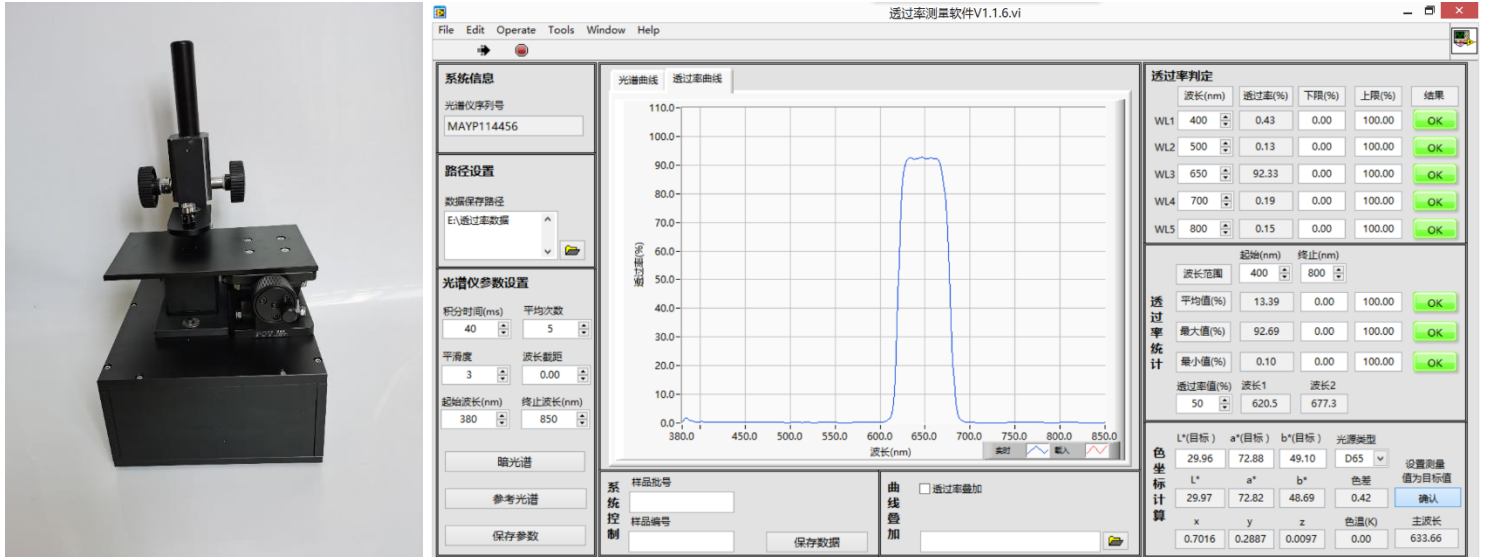


T-1100, 透过率测试仪



一、产品简介

T 系列透过率测试仪是一款全波长的能够快速测量绝对透过率的测试仪(IR 孔或小孔透过率测量仪), 能实时快速准确地测量各类平面、非平面等光学元件的相对或绝对透射率, 可用于实时显示单、多点波长透过率数据及指定波段平均透过率数据。适用于手机盖板 IR 孔、棱镜、镀膜镜、胶合镜、太阳膜、滤光片等平面、光学元件及组合镜头等的检测。

二、功能特点:

- 外界光源干扰去除 (无需在暗环境下测试);
- 支持不同尺寸 lens 的测试, 在样品台有 XY 方向的定位挡板, 同类样品一次调节好位置之后可以连续放样品进行测试, 只需对样品进行微调即可定位和对焦;
- 本仪器能快速测量各类平面光学元件的透射率, 适合批量样片全检, 方便的测量治具, 简单调整一次后, 大批量就无需人工对孔, 即放即测, 最高效率;
- 最快捷的使用、最简单的操作、一键点击、数据直读、放片即测;

- 宽范围精确检测 380-1100nm 光谱，各波段透光率都能显示，除实时全部光谱曲线直接显示外，更可直接显示自定义任意波长的透光率，同时显示平均透光率便于读数；
- 提供常用透过色度参数 x , y , L^* , a^* , b^* ，涵盖 CIE1931, CIE1964
- 可同时记录样品谱图，批量保存测量结果，加载已保存的测量数据，生成对比谱线，实现工艺对比；

三、技术参数：

产品名称：透过率测试仪

型号：T-1100

探测器：Hamamatsu 背照式 2D-CCD

检测范围：380-1100nm

最小测量孔径：>1mm

信噪比（全信号）：450: 1

测量重复性：优于 0.2%（400-1000nm）

测量准确性：优于 0.2%

检出限：0.1%

单次测量时间：<1 秒

光斑：可调（ $\geq \Phi 1.0\text{mm}$ ）

操作系统/接口：Windows 7/8/10；USB2.0

电源/功率：220V-50Hz

四、配置清单

透过率测试仪主机 1 台

卤素灯光源 1 台

光纤 2 根



玉科仪器
YUKE INSTRUMENT

广州玉科仪器有限公司 提供全面光学元件测量解决方案

备用灯泡 2 个

专用软件 1 套